中国海光

第10卷 第12期

倍频激光薄膜——1.06 微米高透 与 0.53 微米高反膜

李 庆 国

(中国科学院上海光机所)

提要: 在 λ/4 多层膜上增加一层附加层,获得了 1.06 微米波长高透和 0.53 微 米波长高反,其主要结果: 1.06 微米,T>99.3%; 0.53 微米, R>99.6%。

Laser thin film for frequency doubling—high transmissivity at 1.06 μ m and high reflectivity at 0.53 μ m

Li Qingguo

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Abstract: High transmissivity at $1.06 \,\mu$ m and high reflectivity at $0.53 \,\mu$ m are obtained by coating a supplementary layer on the $\lambda/4$ stack. The primary results are T > 99.3% at $1.06 \,\mu$ m and R > 99.6% at $0.53 \,\mu$ m.

随着激光倍频技术的发展,对反射膜的 要求也提高了,它要求对基频和倍频光都有 一定的光谱特性。

1.06 微米高透与0.53 微米高反膜,在倍频技术中应用比较广泛。虽然有关这类薄膜的报导较多,但据我们粗略的分析认为,大部分文章都是以长波通(LWF)作为基础,而后修正通带的光谱性能。显然,这在制备工艺上较麻烦,而且1.06 微米波长的透过率起伏也较大。

我们在本文介绍一种较简便的方法,即 在 $\frac{\lambda}{4}$ TiO₂/SiO₂多层膜上增加一层附加层, 达到了1.06微米高透的透过率T>99.3%, 而对 0.53 微米的反射率很高, R>99.6%。

计 算

四分之一周期膜系有一个重要特点:反 射相位是变化的¹¹。在截止带的两侧,相位 随着波长不同而变化。因此,通带的光谱曲 线是波动的,1.06 微米波长正位于通带上。 计算结果表明:如果在多层膜的外侧,即在 空气与多层膜之间增加一层或几层适当薄 膜,会大大改善1.06 微米波长的光谱透射性 能,而对截止带中心反射率的影响不大。于 是,我们在 λ/4 多层膜的外侧增加一层适当 收稿日期: 1982 年 11 月 22 日。 的薄膜,作为附加层,从而达到1.06 微米波 长高透且0.53 微米波长高反射之目的。该附 加层应如何求得呢? 通常可采用薄膜设计的 一般方法去寻找,这里我们采用一组简便的 公式,无需作很多计算便能找到附加层的最 佳条件——折射率 n_F 和相位厚度 δ_F。

A______多层膜系的特征矩阵为:

$$\begin{pmatrix} M_{11} & iM_{12} \\ iM_{21} & M_{22} \end{pmatrix}$$
。
层附加层的特征矩阵为:

$$\left(egin{array}{ccc} m_{11} & m_{12} \ im_{21} & m_{22} \end{array}
ight)$$

根据在垂直入射下特定波长得到零反射的条件^[2],经过推导,得到下面一组公式。

 $n_{F}^{2} = \frac{n_{s}M_{22}(M_{11} - n_{s}M_{22}) - M_{21}(M_{21} - n_{s}M_{12})}{M_{11}(M_{11} - n_{s}M_{22}) - n_{s}M_{12}(M_{21} - n_{s}M_{12})}$ (1)

$$\tan \delta_F = \frac{n_F (n_s M_{12} - M_{21})}{n_F^2 M_{11} - n_s M_{22}}$$
(2)

式中: n_s 为基底玻璃的折射率; n_F、δ_F 分别为 附加层的折射率和相位厚度。

对于主膜系是 $\frac{\lambda}{4}$ 多层膜,如果它的内层 膜(与基底相接)和外层膜(与附加层相接)都 是高折射率层(*H*),附加一层后,截止带中心 的透过率可用公式(3)近似计算:

$$T = \frac{2 T_{0}}{\left\{ \begin{array}{c} 2(m_{22}^{2} + m_{12}^{2}) + \\ (m_{11}m_{22} + m_{12}m_{21})T_{0} \end{array} \right\}}$$
(3)

式中: T_0 是 $\frac{\lambda}{4}$ 多层膜的透过率。

下面就 ZrO₂/SiO₂ 膜系的倍频膜进行一些计算和讨论。

以21层ZrO₂/SiO₂膜为例,附加一层 SiO₂膜后,用公式(3)计算表明,截止带中心 (0.53微米)反射率只降低0.09%。可见,只要 层数选择适当,附加层的介入对其高反射的 影响不甚严重,所以,我们不列为重点考虑。

在 22 层 ZrO₂/SiO₂ 膜的外侧增 加 一 层 附加层, 1.06 微米波长的剩余反射与附加层



的折射率之间的关系如图1所示。

计算表明主膜系的层数不同,对于附加 层的要求也不相同。表1列出 ZrO₂/SiO₂多 层膜的最佳附加层条件。

从以上的计算看出,对于附加层的最佳 条件往往难于达到,但是,从图1结果得知, 在最佳值附近选择,再经实际制备时的修正, 也可以取得比较满意的结果。在我们的实验 工作中也证实了这个事实。

附加层薄膜多使用低折射率薄膜, SiO₂ 膜是比较理想的一种,此外,也可以用 Al₂O₃ 膜和 MgF₂ 膜等。

表1 ZrO₂/SiO₂ 多层膜的附加层

层 数	附加层折射率 (n_F)	附加层光学厚度 (Å)		
21	1.43	3084		
22	1.43	1822		
23	1.21	3048		
24	1.27	3914		
25	1.87	3684		

注: $ZrO_2 - n_H = 1.9$; $SiO_2 - n_L = 1.46$; K₉ - n₈ = 1.51

实 验

本实验工作是在 DMD-450 型镀膜 机上

. 854 .

进行的。采用直射式电子枪蒸涂高熔点氧化 物。

用极值法控制膜层的光学厚度。

(1) ZrO_2/SiO_2 膜系 $G(HL)^{\kappa}n_FA$

ZrO₂膜的光学性质与力学性质是不稳 定的,受工艺的影响极大。因此,要严格掌握 以下工艺条件。

基底温度 140~145°C,

淀积率 600 Å/分

不充 O₂ 淀积, 真空度保持在 1.2×10⁻⁴ 托。

(2) TiO₂/SiO₂ 膜系 $G(HL)^{\kappa}n_{F}A$

TiO₂ 在真空蒸发时要分解,生成低氧态 化合物,使薄膜的光损耗增大。因此,要充 O₂ 淀积。

基底温度 200°C

淀积率 4500 Å/分

充 O₂ 淀积, 充 O₂ 压保持在1.4×10⁻⁴ 托。

(3) 实验结果

我们用 ZrO₂/SiO₂、TiO₂/SiO₂ 两种多层 膜系制备了倍频激光膜。表 2 所列的是部分 结果,这里均没有除掉基底背面的反射影响。 从表中结果看,1.06 微米的透过率都较高, $T \ge 95.5\%$,单面的剩余反射率在0.4~ 0.85%之间。0.53 微米的反射率也比较高, TiO₂/SiO₂ 膜系高达 99.85%。样品玻璃基 底的背面影响,可以在背面镀上相应的增透

编号	主膜系	附加层	附加层 光学厚度(Å)		0.53 微米	1.06 微米
			计算值	实验值	R(%)	T(%)
10-20-A	$\mathrm{ZrO}_2/\mathrm{SiO}_2$	SiO_2	1809	1730	99.39	>95.5
10-21-A	ZrO_2/SiO_2	SiO_2	1809	1830	99.34	95.5
10-28	$\mathrm{TiO}_2/\mathrm{SiO}_2$	Al ₂ O ₃	1466	1400	99.85	95.5
11-11	$\mathrm{TiO}_2/\mathrm{SiO}_2$	Al ₂ O ₃	1466	1410	99.64	95.5
11-18	$\mathrm{TiO}_2/\mathrm{SiO}_2$	Al ₂ O ₃	3038	2800	99.72	95.5

表2 倍频激光膜的测试结果

注: 样品背面均无增透膜

表3 倍频激光膜1.06 微米的透过率

	1.06 微米 T(%)			
编号	背面无增透膜	背面有增透膜		
10-21	95.5	99.8		
10-23	>95	>99.3		
11-6	95.5	>99.6		
11-18	95.5	99.6		
11-12	95.5	99.3		

膜来消除,结果列于表3。

从所测得的光谱曲线看,在1.06 微米附 近曲线比较平,这对于实验的重复性大有好 处,如图2所示。在图中曲线1表示没有涂 膜的K₉玻璃的光谱曲线;曲线2表示TiO₂/ SiO₂(18层)用Al₂O₃膜作为附加层的光谱曲 线;曲线3表示ZrO₂/SiO₂(22层)用SiO₂膜 作为附加层的光谱曲线;曲线4表示长波通 膜系的光谱曲线;曲线5表示曲线2的样品 在其玻璃背面镀有增透膜时的光谱曲线。前 四种样品的基底背面均无增透膜。



讨 论

用本方法制备的 1.06 微米增透 与 0.53 微米全反膜,不仅能达到较高的指标,而且有 很好的重复性。我们连续涂制十次所得样品 1.06微米透过率均在 95~95.5% 之间(背面 没有涂增透膜),单面剩余反射率0.4~ 0.85%。

实验结果能较好地与计算值相符合,不 过,在计算时要注意实验得到的折射率与理 论值之间的差异。最好是把实际淀积的折射 率值引入到计算中来。比如,ZrO2 膜,我们 取三个值,分别代入有关层中计算,效果很 好。

由于主膜系是采用了四分之一波长厚的 规整膜系,所以,制备工艺简便,只要主膜涂 制稳定,不难得到满意的结果。 附加层的光 学厚度是非 $\frac{\lambda}{4}$ 厚,但它是淀积在主膜系的最 后面,经过实验就能找到合适的条件。

为了提高该膜的光学性质,我们特别注 意二次电子对薄膜的损伤,使用直射式电子 枪尤为重要。 我们知道,当电子枪的电子束打到蒸发 材料上时,会产生二次电子。二次电子的强弱 跟电子束能量的大小、被蒸材料的种类及电 子枪结构好坏有直接关系。由于二次电子的 作用,膜面粗糙,有时会出现损伤环,光损耗 增大,反射率大大降低。

我们在本次工作中,设置了二次电子吸收板,同时改变焦斑的位置,使基底处的二次电子密度减小3倍,从而提高了0.53 微米的反射率0.4%以上。

最后,向帮助测试样品的陆月妹、何朝 玲、乔玉令同志致以感谢。

参考文献

[1] 周九林,尹树百译;《光学薄膜技术》,1974年。

[2] J. Mouchat; Appl. Opt., 1977, 16, No. 12, 3237.

光纤传感器及其应用发展预测座谈会在扬州市召开

1983年9月21日至28日,国家科委基础研究 与新技术局在江苏省扬州市召开了光纤传感器及其 应用发展预测座谈会。各高等院校、研究所以及中 央有关部委40名专家教授参加了这次座谈会。

光纤传感器是利用光纤同时做"感"和"传"这两种功能的新型传感器,它的第一显著特点是具有极高的探测传感灵敏度。比如用于测量磁场强度的光纤磁场传感器,在室温条件下现在已经可以检测强度弱到10⁻⁹高斯,理论估计还可以测量弱到10⁻¹³ 高斯,而传统的传感器,在室温条件下最低只能测出 10⁻⁶高斯;又如测量水声的光纤声压传感器,其检测 灵敏度就已经超过常规水声探测器中性能最优的压 电水听器 H560

光纤传感器第二个特点是不受电磁场干扰,不 会产生电火花。因此在有强的电磁场干扰,或者存 在易燃易爆气体等恶劣环境中,这类传感器也能够 可靠地工作,在电力工业、石油化工以及国防军事 上,具有特殊的应用前景。

参加会议的学者在介绍交流国内外光纤传感技术研究、发展和应用情况的基础上,认真讨论分析了 我国发展这项技术的问题,并提出了"关于我国发展 光纤传感技术的建议",会议还决定在明年召开一次 技术方案讨论会。

(纪钟)